

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 166144

АЛМАЗНАЯ ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА

Патентообладатель(ли): *Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра Российской Академии наук (КФТИ КазНЦ РАН) (RU)*

Автор(ы): *см. на обороте*

Заявка № 2016122134

Приоритет полезной модели 03 июня 2016 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 26 октября 2016 г.

Срок действия патента истекает 03 июня 2026 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

 Г.П. Ивлиев





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2016122134/28, 03.06.2016

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
03.06.2016

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 03.06.2016

(45) Опубликовано: 20.11.2016 Бюл. № 32

Адрес для переписки:

420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 10/7,
Физико-технический институт Российской
академии наук, Степанову Андрею Львовичу

(72) Автор(ы):

Степанов Андрей Львович (RU),
Нуждин Владимир Иванович (RU),
Валеев Валерий Фердинандович (RU),
Галяутдинов Мансур Фаляхутдинович (RU),
Курбатова Надежда Васильевна (RU),
Воробьев Вячеслав Валерьевич (RU),
Осин Юрий Николаевич (RU)

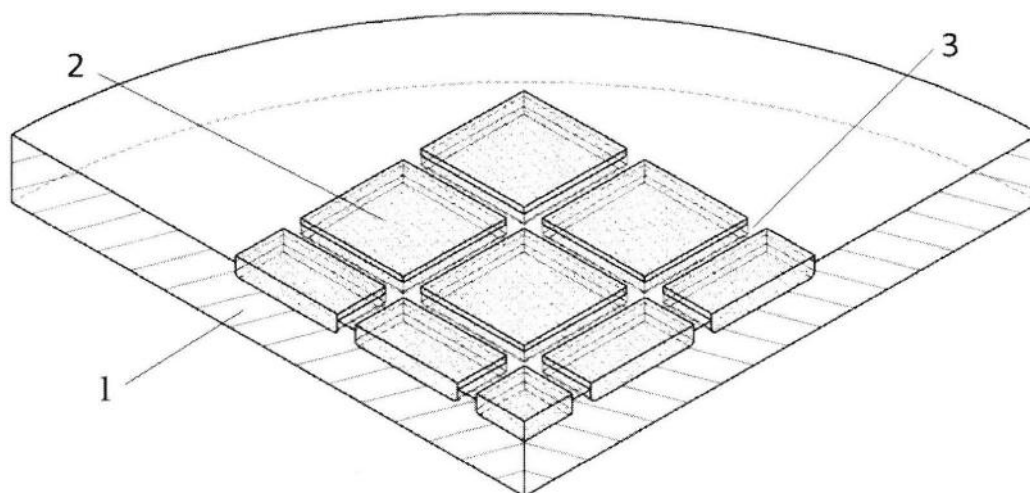
(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Казанский физико-
технический институт им. Е.К. Завойского
Казанского научного центра Российской
Академии наук (КФТИ КазНЦ РАН) (RU)

(54) АЛМАЗНАЯ ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА

(57) Формула полезной модели

Алмазная дифракционная решетка для видимого диапазона, содержащая алмазную подложку с внедренной в ее поверхность дифракционной периодической микроструктурой, отличающаяся тем, что элементами дифракционной периодической микроструктуры являются графитизированные области на поверхности монокристаллического алмаза, подвергнутые ионному облучению ионами бора и характеризующиеся другой диэлектрической проницаемостью относительно материала подложки.



Фиг. 1